

機 器 名	電子顕微鏡 日本電子製 JSM-6610LA
取 得	平成 21 年 7 月
概 要	測定物の電子レンズでの拡大観察、元素分析など。
特 徴	物質の表面観察、さらに非破壊で元素分析を簡単にできる。
用 途	半導体・電子部品などの表面の異物調査、各種原材料の元素分析。
主な仕様	SEM仕様 1. 倍率 5～30万倍 2. 加速電圧 0.3～30kV 3. 検出系 2次電子及び反射電子検出器 EDS仕様 1. 検出可能元素 Be～U 2. 定性・定量分析 試料ステージ 大型ユーセントリック形 X 125 mm Y 100 mm Z 5～80 mm 傾斜 -10～+90° 回転 360°
利用業種	電子部品・メッキ工業、車関係、金型関連、大学等の開発研究など多岐にわたる。
【主に測定されるもの】 各種部品上の汚れ・異物・欠陥等の観察、元素分析	
【テクノコーディネータから一言】 試料の写真撮影をし、それを基に観察・分析するため、大量の試料でも短時間で測定可能です。また、機器操作、測定方法、評価方法について、随時無料講習会を行っております。	
測定機器写真	測定の様子
	